

高加速寿命试验（HALT/HASS试验）

产品名称	高加速寿命试验（HALT/HASS试验）
公司名称	讯科标准技术服务有限公司（检测认证）
价格	5.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	0755-23312011 18126299544

产品详情

高加速寿命试验（HALT/HASS）

高加速寿命试验（HALT/HASS），一款通过高应力，找出产品的设计缺陷，并加以分析改正，可以缩短研发周期，提高产品质量的设备。

服务内容

高加速寿命试验测试流程

一、样品信息背景调查，试验前应对样品进行充分的分析，评估可能发生失效或故障的元部件、连接措施、焊接工艺等。宜提前准备替代或修复措施。

二、试验前确保被试品的安装要求

a) 确保热电偶（控制热电偶）被正确的安装在测试样本上，以便于提供参考给试验箱温度设置调整点。产品的热电偶必须放置在测试单元的外表面，最好放在低热量聚集的地方。这些热电偶不应该放置在产生热量的器件附近或者产品密封部分的内部。产品的响应热电偶应当被安装在能够充分评估样本在温度环境下响应的位置。建议安装位置包括产生主要热量的器件、温敏器件。

b) 确保安装在振动台的测试样本使用了合适的样本夹具，从而能够使得测试样本获得最大的温度和振动应力。产品响应加速计应该被安装在能够充分评估产品对输出振动响应的位置。建议安装位置：靠近固定硬件、最大的反馈点（PCB中央）或者疑似的薄弱位置。

三、高加速寿命试验具体试验项目：

a) 温度步进试验，包括：低温步进应力试验和高温步进应力试验；

- b) 温度变化试验；
- c) 振动步进试验；
- d) 综合环境应力试验；
- e) 回归验证。

服务范围

本测试适用于电工电子产品及其电子部件、印制电路板组件等。对于大型整机，宜优先考虑在前端的装配级别（如印制电路板组件、子模块）上进行试验。还适用于电工电子产品的研发、设计和（或）试产阶段，也可用于批量生产阶段。

检测标准

GB/T 34986-2017/IEC62506：2013产品加速试验方法GB/T 29309-2012电工电子产品加速应力试验规程高加速寿命试验导则4、检测项目电工电子产品及其电子部件、印制电路板组件等产品各研制高加速试验（H ALT/HASS）试验。

相关资质

CNAS

测试周期

1周~2周

服务背景

为什么要做此测试？

- 1、发现设计及程序的限制因素
- 2、评估和改良产品设计极限
- 3、找到极限时统计特色的信息
- 4、减少研发时间及成本
- 5、正式量产前即消除设计上的问题
- 5、作为工程工具作为评估改变对产品造成的影响